

2004A 利用期 トライアルユース実施課題 (表1-1)

【重点領域】 薄膜: 薄膜の構造解析、微量XAFS: 微量元素の局所構造解析

番号	重点領域	課題番号	課題名	実験責任者	所属	シフト数	BL	共同実験機関
1		2004A0140-NI-np-TU	極小角X線散乱法による高分子繊維構造に関する研究	村瀬 浩貴	(株)東洋紡総合研究所	6	BL19B2	京都大学, 高輝度光科学研究センター
2	薄膜	2004A0146-NI-np-TU	LSI, Wプラグの微小部応力測定	尾崎 伸司	(株)松下テクノリサーチ	9	BL46XU	松下電器産業, 大阪大学
3	微量XAFS	2004A0183-NI-np-TU ※	高活性可視光応答型光触媒能を有するTi置換型層状複水酸化物の局所構造解析	中平 敦	京都工芸繊維大学	3	BL19B2	ノリタケカンパニーリミテド, 高輝度光科学研究センター
4	微量XAFS	2004A0237-NI-np-TU ※	$\mu$ -XRFおよび $\mu$ -XAFSによる多結晶シリコン太陽電池中の鉄の結晶内分布および局所的結合状態の研究	大下 祥雄	豊田工業大学	6	BL37XU	高輝度光科学研究センター
5	薄膜	2004A0238-NI-np-TU	微小角入射X線散乱を用いた低誘電率薄膜の動径分布測定	鈴木 貴志	(株)富士通研究所	6	BL46XU	富士通, 理学電機
6		2004A0257-NI-np-TU	X線回折による溶接金属凝固組織のin-situ観察技術の開発	米村 光治	住友金属工業(株)	9	BL46XU	高輝度光科学研究センター, 大阪大学
7	微量XAFS	2004A0281-NI-np-TU ※	XAFSによる高誘電体ゲート絶縁膜材料の構造解析	佐竹 秀喜	(株)東芝	6	BL01B1	京都大学
8	微量XAFS	2004A0288-NI-np-TU ※	光増幅器用Erドープシリケートガラスの局所構造の調査	笹井 淳	旭硝子(株)	3	BL01B1	
9	薄膜	2004A0326-NI-np-TU ※	微小角入射X線散乱による配向膜ポリイミド分子鎖の傾斜角に関する検討	横田 純一郎	チッソ石油化学(株)	9	BL19B2	チッソ
10	薄膜	2004A0335-NI-np-TU ※	有機自己組織化膜の表面回折による構造解析	谷 克彦	(株)リコー	6	BL19B2	
11		2004A0340-NI-np-TU	微小角入射X線散乱測定によるダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜の非晶質構造解析-水素含有量依存性の検討	濱田 糾	松下電工(株)	9	BL19B2	高輝度光科学研究センター, 大阪府立産業技術総合研究所
12	微量XAFS	2004A0403-NI-np-TU	酸化亜鉛セラミックスにおける超微量ドーパントのXAFS	森分 博紀	松下電子部品(株)	6	BL01B1	京都大学, 東京大学, 佐賀県立九州シンクロtron光研究センター, 高輝度光科学研究センター
13	微量XAFS	2004A0467-NI-np-TU	フロートガラス表面における種々イオンの価数分析	滝本 康幸	旭硝子(株)	3	BL19B2	
14		2004A0499-NXb-np-TU	高濃度塩化物中の極微量金属元素の定量	谷内 俊彦	(株)YAKIN川崎	3	BL37XU	日本冶金工業
15	微量XAFS	2004A0531-NI-np-TU ※	家電製品搭載用触媒に担持された希薄金属の局所構造解析	松岡 雅也	大阪府立大学	3	BL19B2	松下電器産業, 高輝度光科学研究センター
16	薄膜	2004A0540-NI-np-TU	Hfアルミネート薄膜の動径分布関数測定	廣沢 一郎	(財)高輝度光科学研究センター	6	BL46XU	半導体先端テクノロジーズ
17	微量XAFS	2004A0579-NI-np-TU ※	蛍光体材料に微量にドーブされた発光サイトのXAFS解析手法の確立	本間 徹生	(財)高輝度光科学研究センター	12	BL01B1	東京化学研究所, ノリタケカンパニーリミテド, 日立化成工業, 東京工科大学
18		2004A0581-NI-np-TU	微小角入射X線散乱法による鉄不動態皮膜の構造解析	山下 正人	姫路工業大学(兵庫県立大学)	9	BL46XU	新日本製鐵, 住友金属工業, 大阪大学, 日本原子力研究所, 高輝度光科学研究センター, 東北大学, JFEスチール, 神戸製鋼所, 三井金属鉱業
19		2004A0586-NI-np-TU	新規なゾルゲル法により調製した酸化チタン薄膜のXAFS測定	井村 達哉	川崎重工業(株)	3	BL19B2	
20	薄膜	2004A0615-NI-np-TU ※	フッ素系潤滑剤の吸着厚み、形態に関するX線の測定	坂根 康夫	(株)松村石油研究所	9	BL19B2	高輝度光科学研究センター
21		2004A0788-RI-np-TU	XAFS測定によるペンタシルゼオライト担持希土類金属(La, Ce)触媒の化学構造解析	斉藤 昇	(株)日本触媒	3	BL19B2	大阪大学, 高輝度光科学研究センター
22		2004A0789-RI-np-TU	Ce賦活Gd <sub>2</sub> SiO <sub>5</sub> 系シンチレータ材料における賦活剤および添加剤置換サイトの解析手法確立	八木 康洋	日立化成工業(株)	6	BL19B2	高輝度光科学研究センター
23		2004A0792-RI-np-TU	X線回折測定による、樹脂モールドされた基板の素子に働く熱応力の分析	一井 秀樹	三相電機(株)	6	BL19B2	
24		2004A0794-RI-np-TU	静電容量と活性炭構造(結晶性)の相関を求める研究	西村 修志	クラレケミカル(株)	3	BL19B2	
25		2004A0795-RI-np-TU	各種ポリマーセメント系材料における白華生成物構造解析および白華防止剤効果の確認	宮下 景子	(株)大関化学研究所	6	BL19B2	高輝度光科学研究センター
26	薄膜	2004A0801-RI-np-TU	表面結晶化度の液晶配向性に与える影響	酒井 隆宏	日産化学工業(株)	9	BL19B2	高輝度光科学研究センター
27		2004A0802-RI-np-TU	X線回折及びXAFS測定による、非晶質Mg <sub>x</sub> Pd <sub>100-x</sub> 合金薄帯の構造解析	濱田 糾	松下電工(株)	9	BL19B2	東北大学, 高輝度光科学研究センター
28	微量XAFS	2004A0810-RI-np-TU	光増幅器用Erドープシリケートガラスの局所構造の調査	笹井 淳	旭硝子(株)	3	BL19B2	
29	微量XAFS	2004A0814-RI-np-TU	水酸化鉄含有活性炭のFe局所構造解析と高As除去能の解明	中平 敦	京都工芸繊維大学	3	BL19B2	二葉商事, いわて産業振興センター, 高輝度光科学研究センター

※ 平成15年度(平成16年3月まで)実施課題